

UISの品質管理DXソリューション

製品の外部、内部欠陥の検査なら

ワンストップのカスタム検査装置メーカー



URCPで最適化

全数検査に
対応

特長1 カスタマイズも可能な
独自開発ソフトウェアで最適化

特長2 エキスパートによる
最適な光学機器・条件選定

特長3 最適な検査装置の設計・製造・
組立

特長4 データアナリストによる
検査データ利活用提案

大手電子部品メーカー様への導入実績多数

セラミック基板、PWB、FPC



- 対象欠陥：オープン・ショート、印刷ズレ・かすみ、クラック、寸法、凹凸等
- コードリーダーやレーザーマーカによるトレーサビリティ対応
- 結果集計やリアルタイム/オフラインでのベリファイ機能
- 両面(2カメラ)×往復(2照明条件)のコンパクト設計

検査精度例
※モノクロ/カラー選択可

16Kカメラ：光学分解能5 μ m、視野幅82mm

8Kカメラ：光学分解能10 μ m、視野幅82mm

検査タクト例

約6秒/枚(モノクロ8K時)

MLCC、コンデンサ関連

内部欠陥検査事例



- 対象欠陥：クラック、欠け、内部剥離、ポイド、寸法等
- 前後工程とのデータ連携にもカスタム対応
- ルールベース+AIのハイブリッド検査による歩留まり改善や、NG分類分析による工程改善データをアウトプット

検査精度例

内部欠陥(超音波)：走査ステップ40 μ m

装置サイズ例

W650xD650xH1377 mm

検査タクト例

ご要望に応じて最適な装置構成にてご提案します

セパレーター、電極シート、フィルム



- 対象欠陥：汚れ、印刷ズレ、異物、変色、凹凸、ピンホール、キズ等
- 要求精度やタクトによって、最適な光学機器・装置構成をご提案

検査精度例

光学分解能3 μ mまたは5 μ m

装置サイズ例

WD：約600mm(4Kカメラ、分解能0.18mm)
約2,300mm(8Kカメラ、分解能0.18mm)

検査タクト例

1.2m/min(3 μ m)、2.1m/min(5 μ m)

品質管理システム **QCOne**

品質管理業務における課題を解決します



データの改ざん防止



ヒューマンエラーを抑止



DXで検査業務効率化

主要機能

データ収集

規格毎設定により厳格な検査値判定

データ解析

管理図、ヒストグラム、パレード図等の出力機能を搭載

成績表出力

成績表レイアウトに検査項目、検査値等をマッピング

承認機能

検査情報、出荷情報の承認処理を搭載

POINT1

検査装置から検査値の自動登録も可能

POINT2

検査データを使った「QC7つ道具」に対応

POINT3

顧客様式にあわせた成績表出力が可能

POINT4

承認機能によりコーポレートガバナンス強化を実現

NEW 組立・加工製造業様向けに

「全数検査、抜取り検査」機能と「図面参照」機能を追加!

「全数検査、抜取り検査」機能

1ロット複数検査を入力し集計値による規格判定をしたい

【機能概要】

- 1ロット中の検査項目に複数の検査結果を登録可能
- 検査回数分データのグラフ表示、帳票出力
- 集計値（平均、最小、最大、中央）による規格判定

検査結果入力画面



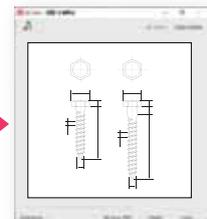
管理図画面

「図面参照」機能

製品検査時に図面参照しながら検査値を入力したい

【機能概要】

- 検査図面情報のマスタ管理
- 検査結果の登録時に図面を表示
- 品目毎の図面管理



製品詳細はこちら



本社／営業企画部

〒755-8622
山口県宇部市相生町 8-1 宇部興産ビル
TEL. 0836-22-0112

ソリューション営業部

東京オフィス 〒105-0013 東京都港区浜松町 1-22-5 KDX 浜松町センタービル
TEL. 03-3433-4201

大阪オフィス 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 2-2-2 大阪中之島ビル8階
TEL. 06-6203-6200